文

論

多孔板遮蔽構造を持つ軟X線イオナイザーの除電性能の評価 佐藤 朋且*^{,1},鈴木 政典*,水野 彰** (2012年1月31日受付;2012年4月13日受理)

Evaluation of Charge Eliminating Performance of the Soft X-ray Ionizer with the Shielding Structure Consisting of a Perforated Plate

Tomokatsu SATO,*,1 Masanori SUZUKI* and Akira MIZUNO**

(Received January 31, 2012; Accepted April 13, 2012)

Recently, ionizers employing low energy X-rays of 3 to 9.5 keV have been used in semiconductor industries, LCD manufacturing processes and pharmaceutical processes. However, when these ionizers are installed in manufacturing equipment, the equipment must be covered with shielding panels to shield the soft X-ray. In addition, this equipment requires safety measures to stop ionizers automatically when a worker entered a shielding area by any chance. For those reasons, the X-ray ionizers have been inconvenient for practical use. Therefore we have been developing a soft X-ray ionizer with shielding structure. In the previous paper, we reported the results of investigation on performance of the shielding structure consisting of small metal pipes. In this paper, we report the results of investigation on the influence of the supply air volume and air inlet position at the ion generating chamber with the shielding structure consisting of a perforated plate, for optimizing charge eliminating performance of this ionizer.

1. はじめに

近年,半導体や液晶製造,また医薬品製造のクリーンルームにおいて,除電性能に優れ,無発塵であることから,エネルギーが3-9.5 keV (ピーク 約6 keV)の低エネルギーX線(軟X線)をイオン化源とするイオナイザーが利用されるようになった.しかし,生産ラインでこのイオナイザーを使用する場合には,軟X線を遮蔽するため生産装置を遮蔽板で区画し,万一作業者が立ち入った場合でも軟X線照射が自動停止するインターロック対策が必要で,取扱いが比較的不便であった.そこで,イオナイザー自体から発塵や軟X線の漏れが無く,遮蔽の必要が無いイオナイザーを考案した.このイオナイザーでは,チャンバー内で軟X線照射により正負の空気イオンを生成し,これらのイオンを取り出して除電に利用する.このため,正負の空気イオンは通過するが軟X線は遮蔽するような構造体が必要となる.既報^{1,2)}では,図1に示すように,イオン化したエアーの吹出部を,小孔径の金属パ

キーワード: クリーンルーム,イオナイザー,除電性能 軟 X 線,遮蔽構造

* 株式会社テクノ菱和(156-0052 東京都世田谷区経堂 5-33-6) Technical R&D Center, Techno Ryowa LTD., 33-6 Kyodo

Fernitear Reeb Center, Teenito Ryowa ETD., 55 0 Ryoud
5-Chome, Setagaya-ku, Tokyo 156-0052, Japan
** 豊橋技術科学大学(441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ

匠 1-1) Toyohashi University of Technology, 1-1 Hibarigaoka,

Tenpaku-cho, Toyohashi, Aichi 441–8580, Japan

¹ t_satou@techno-ryowa.co.jp

イプから成る遮蔽構造としたイオナイザーについて検討し, 軟X線の漏洩線量率を1µSv/hr以下にでき,かつ,正負の空 気イオンが十分に通過することを確認した.本報では,この 金属パイプによる遮蔽原理を応用し,金属パイプと同様の遮 蔽効果を有する,厚みを持った多孔板状の吹出部を設計し, このイオナイザーの除電性能を最適化することを目的とし て,供給エアー量,イオン化チャンバー内の気流性状等が除 電性能に与える影響を調査したので,その結果を報告する.

2. 遮蔽構造を持つ軟 X 線イオナイザーの概要

図2に今回検討したイオナイザーの概略図を示す.このイ オナイザーは、角筒状のチャンバー内を軟X線でイオン化し、 発生させた正負の空気イオンを除電箇所に吹付けるもので ある.イオン化エアー吹出部は、小孔を配列した1枚の厚み を持った多孔板状の構造で、この孔径および板厚によって空 気イオンは通すが、軟X線は遮蔽する構造になっている.多 孔板構造としたことで、金属パイプによる遮蔽構造と同様の 遮蔽効果を有しながら、構造がシンプルで製作が容易になり、 製作コストの低減も実現している.このイオナイザーの主な 特徴を以下に示す.

(1)イオナイザー自体が軟 X 線の遮蔽構造で,設置の際遮蔽 の必要が無い.

(2)無発塵で、かつ、オゾンの発生が無い.

(3)軟X線ヘッドの交換だけで、他のメンテナンスは不要.

3. 実験装置および評価方法

軟 X 線の線量率を 1 μ Sv/hr 以下に遮蔽するための,多孔板 の孔径および板厚は, 既報^{1,2)}の金属パイプによる遮蔽性能の 検討結果を用いて以下のように設計した. 図 3 の, 軟 X 線管 を収めた遮蔽筒にパイプを打込んだ実験装置において, 軟 X 線源から照射された軟 X 線は, 一部が打込んだパイプ内を透 過して, パイプの外部まで到達する. 軟 X 線源から任意の距 離における軟 X 線の線量率を, パイプ透過前の入射線量率 I_{inlet} , パイプを透過して外部に到達した線量率を透過線量率 I_{outlet} どすると, 透過率は $P = I_{ottet} / I_{inlet}$ で表され, 透過線量率 I_{outlet} が常に 1 μ Sv/h 以下となるような透過率のパイプを選定 する.軟 X 線源から任意の距離における入射線量率 I_{inlet} は, 既報³⁾で求めた, 軟 X 線源から任意の距離 X における空気中 での軟 X 線線量率 I_{x} の近似式 (1) を用いて計算する.

$$I_X = 4.0 \times 10^6 e^{-0.0055X} (X \le 740 \text{mm}) [\mu \text{Sv/h}]$$
 (1)

また,透過線量率 I_{outlet} が1 μ Sv/hrとなる透過率を P_1 とすると, P_1 は以下の式 (2) のように求められる.

$$P_1 = I_{outlet} / I_{inlet} = 1 / I_X = 0.25 \times 10^{-6} e^{0.0055X} (X \le 740 \text{ mm})$$
(2)

ー方, 既報^{1,2)}では, 4 種類の金属パイプ(パイプ a: 内径 3 mm× 長さ 10 mm, パイプ b: 内径 3 mm× 長さ 20 mm, パイプ c: 内径 4 mm× 長さ 10 mm, パイプ d: 内径 4 mm× 長さ 20 mm) について, 軟 X 線源から任意の距離における透過率を求めて おり, これらをそれぞれ P_a , P_b , P_c , P_d とすると, 上記で 求めた P_1 と比較して, $P_1 > P_a - P_d$ となる金属パイプを選定す ることで, 透過線量率が常に 1 μ Sv/h以下となる. 図 4 に P_1 と $P_a - P_d$ の比較を示す. 図 4 より, $P_1 > P_a - P_d$ となる金属パイ プの内, なるべく内径が大きく, 長さが短いものを選定する. これは, パイプ内を透過する際の, 正負イオンの再結合によ る消耗を考慮した場合, 漏れ線量率を抑える一方で, パイプ の径はなるべく大きく, パイプの長さは短いものを選定する 方が除電性能面で有利となるためである. 選定した金属パイ プの内径を多孔板の孔径に, 金属パイプの長さを多孔板の板



図1 パイプを用いた遮蔽構造を持つ軟X線イオナイザー





図2 多孔板を用いた遮蔽構造を持つ軟X線イオナイザー

Fig. 2 Soft X-ray ionizer with shielding structure consisting of a perforated plate.



図3 入射線量率 I_{inlet} と透過線量率 I_{outlet}

Fig. 3 The dose rate at inlet and the dose rate at outlet.



図4 $P_1(I_{outlet}=1 \mu Sv/hr) と P_a-P_d(金属パイプ透過率)の比較 Fig. 4 Comparison of <math>P_1$ and P_a-P_d .

厚として置き換えると、多孔板からの透過線量率が1 µSv/hr 以下となる孔径と板厚が決定する.設計した多孔板の詳細を 図5に、この多孔板を装着したイオナイザー実験装置の概略 を図6に示す.多孔板の孔は、軟X線照射部から水平距離で 50 mm 離し, 照射部に近いエリアに φ3 mm の孔を 20 mm ピ ッチで 20 個 (10 個 ×2 列), 次いで φ4 mm の孔を 20 mm ピ ッチで18個 (9個×2列) 配した. 板厚を20mm, サイズを 430 mm (W) × 130 mm (D) とし、この孔径と板厚により、 透過する軟X線の線量率がどの位置においても1 µSv/h以下 となる. この多孔板を吹出部とするイオン化チャンバーに軟 X線ヘッドを取付け, チャンバー内をイオン化する. コンプ レッサーからのエアーをイオン化チャンバーに供給し,多孔 板の孔からイオン化エアーを吹出す. イオン化チャンバーは, 容積の違いによる影響を見るため高さのみ異なる、チャンバ ーA(高さ260mm), チャンバーB(高さ130mm)の2種類 で評価を行った.供給エアー量はマスフローメーター (SMC

製 PF2A71) で計測した.除電性能は,帯電プレートモニタ ー (以下 CPM, Trek 製 Model 158)の金属プレート (152 mm×152 mm, 20 pF±2 pF)を吹出部下方に設置し,+1 kV も しくは-1 kV に帯電させ,その初期電位が吹出部からのイオ ン化エアーによって十分の一の+0.1kV もしくは-0.1kV ま で減衰する時間(除電時間)を測定して評価した.除電時間 は短いほど,除電性能が優れていることを示す.また,金属 プレートを正極性に帯電させた場合は,負イオンによる除電 性能を,負極性の場合は,正イオンによる除電性能を評価し たことを示す.測定点は吹出部下方 50 mm の位置で,軟 X 線照射部から水平距離が ① 110 mm (φ 3 mm の孔のエリア), ② 240 mm (φ 3 mm と φ 4 mm の孔の混在エリア),③ 370 mm (φ 4 mm の孔のエリア)の3箇所とし,CPM 金属プレート の中心が ①-③ となるように設置した.

なお、多孔板の遮蔽性能は、電離箱式サーベイメータ(ア ロカ製 ICS-321R1)で軟 X線の漏洩線量率を測定し、1μSv/hr 以下であることを確認した.遮蔽の基準値(漏れ線量率の許 容値)を1μSv/hr以下とした理由は、X線応用装置の筐体外 側における許容値を、慣例的に安全上1μSv/hr以下としてい ることに基づいている.

4. 実験結果および考察

4.1 供給エアー量が除電性能に与える影響

イオナイザーのイオン化チャンバーに供給するエアー量 が除電性能に与える影響を検討するために、コンプレッサー からのエアー量を100 L/min, 200 L/min, 300 L/min と変化さ せた時の除電時間を測定した. 図7に結果を示す. 容積(高 さ)の異なるチャンバー A, B 共に供給エアー量が多い程, 全体的に除電時間は短縮し,除電性能が向上した. これは, 供給するエアー量が多い程,イオン化チャンバー内で軟X線 によりイオン化されたエアーの吹出量そのものが増加する ためと考えられる. 一方,供給エアー量に依らず,測定点①, ②,③,つまりイオン化チャンバーの長手方向で除電時間に差 が見られ,軟X線源に近い位置程除電性能が良い傾向,さら にチャンバー A と B では,容積の小さい(高さの低い)チャ ンバー B の方が除電性能が良い傾向が見られた. これらの傾 向については,供給エアー量以外のパラメータの影響と考え





図6 実験装置の概略(模式図)





図7 供給エアー量が除電性能に与える影響

Fig. 7 Influence of the supply air volume on voltage decay time.

られる. なお, ここに示す結果は, 負イオンによる除電性能 を示しているが, 正イオンによる場合も同様の傾向を示した.

4.2 イオン化チャンバー内の軟 X 線強度とイオン化 エアー量が除電性能に与える影響

前項 4.1 で見られた傾向も踏まえ,次に,各測定点でのイ オン化チャンバー内の軟 X線の強度とイオン化エアー量(吹 出部から吹出すエアー量)が,除電性能に与える影響を調査 した.なお,イオン化チャンバー内の測定点①,②,③の位 置の軟 X線の強度についても,前述の,式(1)を用いて線量率 として算出した.測定点①,②,③の位置におけるイオン化 エアー量は,図8に示すように,各測定点に CPM の金属プ レートを設置した時に,CPM 金属プレート面積分のエリアに ある多孔板の孔から吹出される風量と定義して測定した.測 定点①の場合は、φ3 mm の孔 14 個分,測定点②は、φ3 mm の孔 8 個とφ4 mm の孔 8 個分,測定点③は、φ4 mm の孔 12 個分から吹出される風量となる.イオン化チャンバー内の軟 X 線強度と除電時間の関係を図 9 に、各測定点のイオン化エ アー量と除電時間の関係を図 10 に示す.

図9に示すように、軟X線の線量率は、線源に近い程大き く、線源からの距離と共に急激に減衰し、軟X線線量率が最 大の測定点①で最も除電時間が短く、線量率の減衰に伴い除 電時間が長くなった.線源からの距離によってイオン化チャ ンバー内の軟X線強度が変化し、それによって生じるイオン の密度も変化するため、除電性能に影響を及ぼしたと考えら れる.前項4.1で述べた、イオン化チャンバーの長手方向(測 定点①、②、③)で除電性能に差が見られた原因として、こ のイオン化チャンバー内の軟X線強度が考えられる.

次に、図 10 に示す各測定点のイオン化エアー量は、チャ ンバーA, B とも、測定点①のエリアが最少、次いで測定点 ②のエリアが大きく、測定点③のエリアが最大となった.こ の相違は、測定点①が φ3 mm の孔、測定点②が φ3 mm と φ4 mmの孔, 測定点③が φ4 mmの孔のエリアにあるため, その 孔の抵抗の影響を受けた結果と考えられる. 除電時間との関 係を見ると、イオン化エアー量が最少の測定点①で除電時間 が最も短く、イオン化エアー量が最大の測定点③で除電時間 が最も長い結果となっている.これは、測定点①のイオン化 エアーが、測定点③のイオン化エアーよりも、イオンの密度 が高いことを示している. このことから, 各測定点における 除電性能には、その測定点のイオン化エアー量よりも、その 測定点のイオン化チャンバー内の軟 X 線強度の相違による イオン密度の相違が影響していると考えられる.一方、チャ ンバーAとBの各測定点でのイオン化エアー量を比較すると, どの測定点においてもほぼ等しいにも拘らず,前項4.1でも 述べたように、チャンバーAとBの除電性能は、容積の小さ い(高さの低い)チャンバーBの方が良い.同じ測定点では,



Fig. 8 Distribution of perforation at measuring point ①, ②, ③.



Fig. 9 Relationship between the dose rate and the voltage decay time.



Fig. 10 Relationship between the ionized air volume and the voltage decay time.

イオン化チャンバー内の軟 X 線強度は等しいため, チャンバーA と B の除電性能の差は, 軟 X 線の強度以外の要因で生じたイオン化チャンバー内のイオン密度の相違が影響したものと考えられる.

4.3 チャンバー内気流性状が除電性能に与える影響

軟 X 線の強度分布以外で、イオン化チャンバー内のイオン 密度に差が生じる要因としては、イオン化チャンバー内の気 流性状が考えられる.そこで、イオン化チャンバー内気流性 状の影響を調べるため、イオン化チャンバーへのエアー導入 位置を変えて除電時間を測定した.エアー導入位置は、図 11 に示すように、線源側からの導入位置をa(チャンバーA)、b (チャンバーB)として、それぞれの同一直線上の対面側をa' (チャンバーA)、b'(チャンバーB)とした.各測定点での 除電時間を図 12 に、この時の各測定点のイオン化エアー量 の分布を図 13 に示す.

図 12 より, a' と b' からエアーを導入した場合には, 元の 導入位置の a と b からエアーを導入した場合と比べて, 全て の測定点で除電時間が短縮した. 一方, 図 13 に示すように, a' と b' からエアーを導入した場合の各測定点でのイオン化 エアー量は、前項4.2 の図10で示した、元のエアー導入位置 (a, b) でのイオン化エアー量とほぼ同じ分布となった. エ アー導入位置を変えた場合でも、吹出部である多孔板の孔の 抵抗によって、各測定点のイオン化エアー量の分布自体は変 わらないが、エアー導入位置が変わったことでイオン化チャ ンバー内の気流性状が変化したため、各測定点のイオン化エ アー中のイオン密度が高くなり、除電性能が向上したと考え られる.またこれは、前項4.1 で見られた、容積の異なるチ ャンバーAとBの除電性能に差が現れる傾向の原因の一つで もあり、チャンバー容積の違い(高さの違い)でチャンバー 内の気流性状が異なり、各測定点のイオン化エアー中のイオ ン密度に差が生じたためと考えられる.

これらを確認するために、エアーの導入位置やチャンバー 容積(高さ)を変えた場合のイオン化チャンバー内の気流性 状について、気流シミュレーションを行った.計算対象のチ ャンバー形状、エアー導入位置、吹出部の多孔板の孔径、孔 ピッチの条件は、除電性能測定に用いた実験装置と同様とし た.また、エアー導入位置から300 L/minで給気を与え、多 孔板の孔から吹出した気流は自然流出するものとし、電界や 温度については考慮しない.計算に用いたソフトは SCRYU/Tetra (クレイドル社)、メッシュシステムに非構造格 子、計算方法に SIMPLE 法、乱流モデルに K-ε モデル、対象 流体を非圧縮性流体として計算を行った.各パターンでのイ オン化チャンバー内の気流性状の断面を図 14 に示す。元の 導入位置であるa(チャンバーA)とb(チャンバーB)から







Fig. 13 Relationship between the ionized air volume and the voltage decay time (Air inlet a', b').



図14 イオン化チャンバー内の気流パターン

Fig. 14 Air flow pattern in the ion generating chamber.

エアーを導入した場合は、線源側の軟X線強度の強いエリア でイオン化された気流が、反対側の軟X線強度の弱いエリア に向って流れ, 吹出部に向かって下降し, イオン化チャンバ 一外へ搬送される動きとなっている.この経路を辿る間に生 成したイオンの再結合が促進し、イオン密度が低下している ことが考えられる. 一方 a' (チャンバーA) と b' (チャンバ -B)からエアーを導入した場合は、軟X線強度の強いエリ アに向かって気流が流れ,線源近傍の最も軟X線強度の強い エリアでイオン化され,直後に吹出部に到達している.イオ ン化されてから吹出部に到達するまでの経路が短いため、イ オン密度が高い状態のままチャンバー外に搬送されている ことが考えられる、供給エアーの導入位置によってイオン密 度(除電性能)に差が生じるのは、こうした気流性状の影響 と考えられる (図 14-(a), (b)と(c), (d)の比較). 次に, 容積 の異なる(高さの異なる)チャンバーAとBについて見ると, 元の導入位置 a, bからエアーを導入した場合, 容積が小さ いチャンバーBは、チャンバーAよりも高さが低く、エアー 導入位置と線源との距離がチャンバーAより短い.従って, b から導入したエアーは、a から導入したエアーよりも軟 X 線強度のより強い位置を通過するため、イオン密度が高くな る.一方,対面側の a'、b'から導入したエアーは、どちらも 線源近傍でイオン化された直後に吹出部に到達し、チャンバ ー外までのイオン化エアーが辿る経路に差が無い.従って、 イオン化エアーのイオン密度にも差が無く、除電性能がほぼ 等しくなる. チャンバーの容積, すなわちチャンバーの高さ によってもイオン密度(除電性能)に差が生じるのはこのた めと考えられる(図14-(a)と(b)の比較,図14-(c)と(d)の比較).

5. まとめ

多孔板を用いた遮蔽構造の軟 X 線イオナイザーの除電性 能を最適化することを目的として,諸因子が除電性能へ与え る影響を調査した.その結果を以下に示す.

- ①イオナイザーに供給するエアー量が多い程,全体的な除 電性能は向上する.
- ②イオナイザーからのイオン化エアー量の分布は、軟X線 遮蔽用の多孔板の孔の抵抗で決定され、供給エアーの導 入位置やイオン化チャンバー形状によらない。
- ③除電性能は主としてイオン化エアー中のイオン密度に よって決まり、そのイオン密度は、イオン化チャンバー 内の軟 X 線強度とイオン化チャンバー内の気流性状の 影響を受ける。
- ④イオン化チャンバー内の軟 X 線強度やイオン化チャン バー内の気流性状を制御し、イオン密度を高くすること で除電性能を向上できる.

参考文献

- 鈴木政典,佐藤朋且,松橋秀明,水野 彰:遮蔽構造を 持つ軟 X 線イオナイザーの遮蔽性能の評価.静電気学会 誌,31 (2007) 31
- 佐藤朋且,鈴木政典,松橋秀明:遮蔽構造を持つ軟エッ クス線イオナイザーの開発(その2).第24回空気清浄 とコンタミネーションコントロール研究大会予稿集,p. 210,日本空気清浄協会(2006)
- 佐藤朋且,鈴木政典:遮蔽構造を有する軟 X 線イオナイ ザーの開発.第15回 EOS/ESD/EMC シンポジウム予稿 集, p.171,日本電子部品信頼性センター (2005)